JP 352253532 A DEC 1987

(54) WAFER PROCESSOR

(11) 62-283632 (A) (43) 9.12.1987 (19) JP

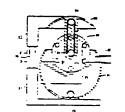
(21) Appl. No. 61-126375 (22) 31.5.1986

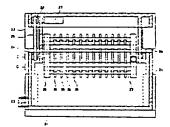
(71) TOSHIBA CORP (72) MINORU FUJIMOTO

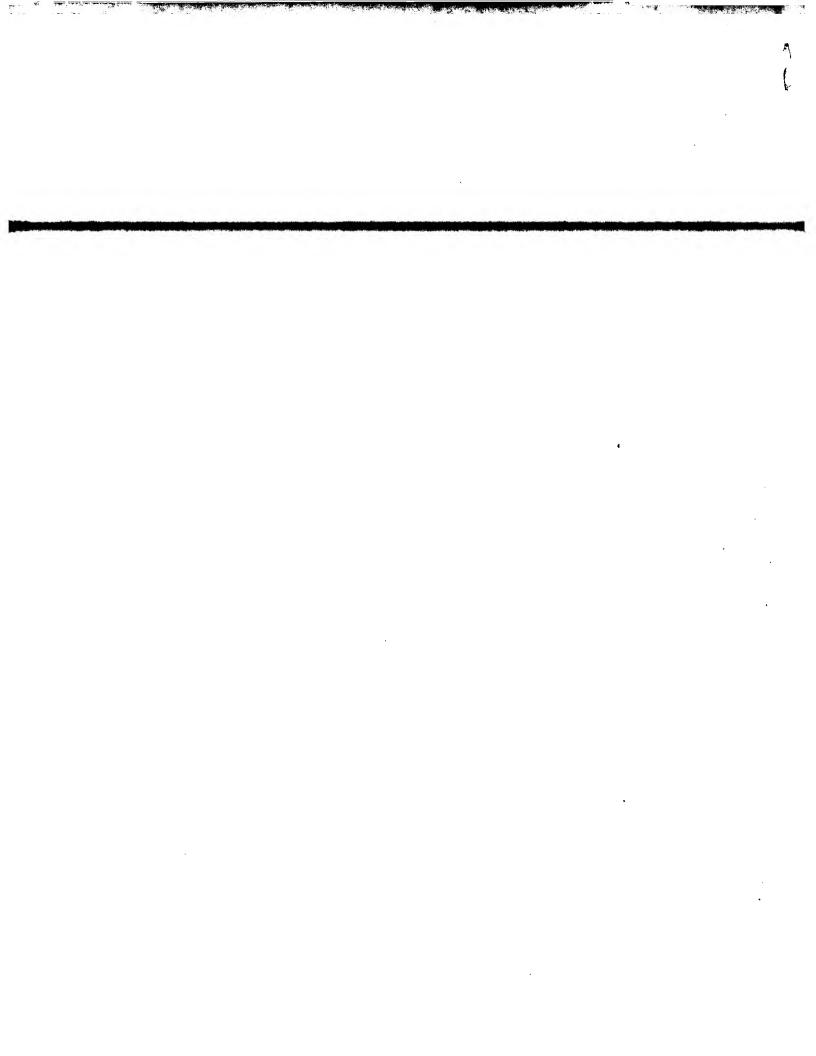
(51) Int. Cl⁴. H01L21 304.B08B3 04

PURPOSE: To largely increase the cleaning effect of a wafer, to reduce the contamination, to save energy and to decrease the cleaning irregularity of the wafer by cleaning and drying the wafer in a processing tank while rotating and vertically moving the carrier of the wafer.

CONSTITUTION: When a medicine is filled in a processing tank 21 and power is supplied to a rotating mechanism 27 and an elevationally moving mechanism 30, a carrier 25 is secured to a lower position in the tank 21 and rotated at a low speed. Air bubbles adhered to a wafer 26 are effectively removed by the rotation to clean medicine. Then, an outlet 23 is opened to discharge the medicine, and cleaning wafer is fed from a cleaning water inlet 22. In this case, the carrier 25 is accelerated from low to middle speed, elevationally fluctuated to be fed and cleaned. Then, the water is immediately discharged, the carrier 25 is rotated at a high speed to drip and dry the wafer 26. Thus, a product of stable and high guilty having no cleaning irregularity can be obtained.







⑩日本国符許庁(JP)

⑪特許出題公開

⑫公開特許公報(A)

昭62-283632

30Int Cl.*

識別記号

厅内整理番号

❷公開 昭和62年(1987)12月9日

H 01 L 21/304 B 08 B 3/04 D - 7376-5F A - 6420-3B

審査請求 未請求 発明の数 1 (全+頁)

②発明の名称 ウェハ処理装置

②特 顧 昭61-126375☆出 顧 昭61(1986)5月31日

發発 明 者 藤 本 実 大分市大字松岡3500番地 株式会社東芝大分工場内

②出 頭 人 株式会社東芝 川崎市幸区堀川町72番地

念代 理 人 弁理士 鈴江 武彦 外2名

明和四型

1. 発明の名称

ウェハ処理装置 2. 特許請求の範囲

複数 枚のウェハを洗浄、乾燥する処理 個とにで の処理 個の上方に配置され 前記 ウェハを 回転 で の処理 個の上方に配置され 前記 型 圏 内 で 回転 で このキャリアを 処理 個に対 ア と の の 記 は と か ら 前記 や で り っ か 記 い で 下 ひ ゆ で 行 な う こ と を 特 成 と す る ウェ ハ 処理 個内 で 行 な う こ と を 特 成 と す る ウェ ハ 処理 個内 で 行 な う こ と を 特 成 と す る ウェ ハ 処理 個内 で 行 な う こ と を 特 成 と す る ウェ ハ 処理 電 表 で の 強 優 を 前 記 処理 個内 で 行 な う こ と を 特 成 と す る ウェ ハ 処理 の で 質 愛 こ

3. 発明の詳報な説明

〔発明の目的〕

(発明の技術分野)

本発明は、ウェハの洗浄、 **を**類を行なうウェ ハ**近**理装置に改良に関する。

(従来の技術

従来、半導体集員回路製造ライン内の半導体 ウェハ要品型理工程において、半導体ウェハを裏 品洗净、流水洗浄、乾燥を順次行なう深、英品洗浄は第3回に示す装置を用いて行われる。図中の1は、薬品2を収容した異品洗浄槽である。この薬品洗浄槽1内にはキャリア3が浸漬され、寒キャリア3には複数枚のウェハ4…が立設されている。このようにウェハ4…を裏品洗浄槽1内に浸漬した状態でウェハ4…の裏品処理を行なっていた

しかしながら、こうした洗浄手段によれば、ウェハ3…が静止した状態で英品洗浄されるため、ウェハ4…の表面、キャリア1号に付着した気泡 5が除去されない。従って、高い薬品洗浄効果が明持できない。

そこで、桑品洗浄槽1内のキャリア3を人手により揺する等の作業により、気包5を取除くことにより洗浄効果を高める事が考えられる。しかし、この方法は揺すりが人手によるため、作業性が恐いとともに裏品処理後のウェハ4にムラが出来るという不必合が生じる。

次に、薬品洗浄したウェハ4は、羽4回に装置

特開昭62-283632(2)

たさり記な法律さいる。 图中の11日。な法律目 である。この水洗浄槽11の産郵側には小孔12 …を有した多孔板13が設けられ、この多孔板 13により前記水洗浄槽11の底部側に洗浄水供 給那型が形成される。この部塁には、洗浄水流入 口14から洗浄水15が供給される。前記多孔板 13上にはキャリア3が収置され、このキャリア 3には薬品洗浄を終了した複数枚のウェハ4…が 立設されている。こうした構造の装置において、 複数枚のウェハ4…が立設されたキャリア3を多 孔板13上に載置した状態で、まず洗浄流入口 14より洗浄水15を水洗浄槽11の産郵酬の郵 塁に渡入させる。渡入した洗浄水15は、多孔板 13の複数の小孔12より水洗浄槽11の上方に 供給され、ウェハ4…の洗浄が行われる。しかし ながら、こうした洗浄手段によれば、薬品洗浄の 場合と同様、ウェハ4の表面やキャリア3に付着 した気包5が除去されない。また、洗浄水15の 流速が遅く、高い洗浄効果が期待できない。そこ で、前述したように水洗浄槽内でキャリア3を人

手より回することが考えられるが、作品性の低下 と関品ならをもたらす。

次いで、乾燥については、従来洗浄槽と乾燥で 置が分れている。従って、各処理へのキャリア移動が多く、人手を受し、移動中のアクシデント、 汚染をもたらすとともに、スペース的問題で作業 性が悪く製品むらをもたらす。

(発明が解決しようとする問題点)

本発明は上記事情に盛みてなされたもので、ウェハの洗浄効果を大幅に向上するとともに、流水洗浄後直ぐに乾燥ができ汚染の減少、省力化、洗浄むらの減少等が達成できるウェハ処理装置を提供することを目的とする。

〔発明の構成〕

(問題点を解決するための手段)

本発明は、複数枚のウェハを洗浄、乾燥する
処理情と、この処理情の上方に配置され前記ウェ
ハを支持するキャリアと、このキャリアを処理情
内で回転させる回転機構と、前記キャリアを処理
情に対して上下動させる上下機構とからなり、前

記キャリアを回転、上下動させながら前記ウェハの洗浄及び乾燥を前記処理権内で行なうことを特徴とし、ウェハの洗浄効果の大幅な増大と、汚染の減少、省カ化、洗浄むらの減少等をなしえる。

本発明によれば、回転機構及び上下動機構によりウェハをセットしたキャリアを回転、上車型をはながらウェハの洗浄及び乾燥を同一の処理機内で行なうことができるため、ウェハの洗浄効果を従来と比べ大幅に向上できる。また、洗浄後のメントを直ちに乾燥できるため、従来と比べ汚染のメン、省力化、洗浄むらの減少等なしえる。

(実施例)

(作用)

以下、本発明の一実施例を第1回及び第2回を参照して説明する。ここで、第1回は本発明に 照るウェハ処理装置の一部断面で示す。第1回以本発明に 2回は同義置の一部断面で示す。第1回回である。

図中の21は、上部が前口した処理権である。 この処理権21の上部には洗浄水入口22が設けられ、かつ処理権21の底部には排水口23が設 次に、上記構造の処理装置の動作について説明する。

①まず、洗浄水入口222より処理信21内に英品を设入する。英品が定量になり、前記回転機構 27、上下機構30に電源を投入すると、キャリ

特開昭62-283632(3)

7 2 5 が処理権 2 1 内の抵立置に固定され低速で回転する。この回転により、ウェハ 2 6 に付着した気泡は確実に取り除かれ、高い洗浄効果をもって乗品洗浄ができる。

事業水洗浄が移了したら、査ぐに洗浄水を全く 排水し、キャリア25を再選で回転してウェハ 26の水切を塊を行なう。以上より、洗浄むらの ない安定した高品質な製品を得ることができる。

上記実施例によれば、回転機構 2 7、上下機構 3 0 により、ウェハ 2 6 をセットしたキャリア

25を回転、上下的させながらウェハ26の洗浄 及び乾燥を同一の処理権21内で行なうことができる機道となっているため、ウェハ26の洗浄の 果を大幅に向上できる。また、洗水洗浄したウェ ハを直ちに乾燥できるため、健果のようにキャリ アを各処理へ移動する必要もなく、汚染の減少、 省力化、洗浄むらの減少等をなしえる。

なお、上記実施例では、ウェット要品でウェハ を処理したが、これに限らず、ガスで処理を行なってもよい。

〔発明の効果〕

以上許述した如く本発剤によれば、ウェハの 洗浄効果を大幅に向上するとともに、汚染の減少、 省力化、洗浄むらの減少等をなしえるウェハ処理 複数を提供できる。

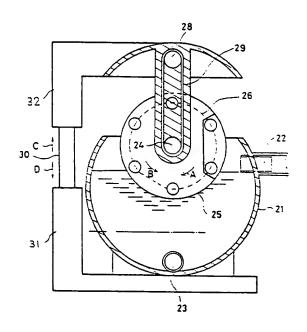
4. 図面の周単な説明

第13日は本発明の一実施例に係るウェハ処理を 2の一部新面で示す正面図、第2回は同様度の一部新面で示す類面図、第3回は従来の変品処理用 の後置の新面図、第4回は従来の洗浄処理用の後

置の断面図である。

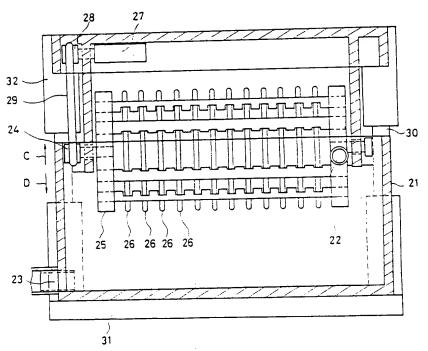
2 1 … 処理相、2 2 … 洗浄水入口、2 3 … 排水口、2 4、2 8 … アーリ、2 5 … キャリア、2 6 … ウェハ、2 7 … 回転機構、2 9 … ベルト、3 0 … 回転機構、3 1 … シリンダー保持部、3 2 … 支持兼処理権のバー。

出籍人代理人 弁理士 鈴江武等

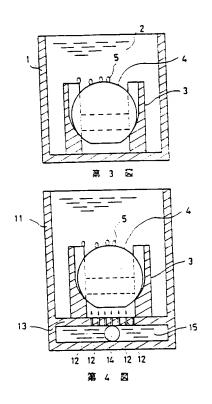


第 1 图

特開昭62-283632(4)



第 2 凶



-170-